

# 計量標準整備計画(2001～2010年度)総括表1【物理標準】

整理番号	種類	項目	供給済み範囲	供給済み (2011年3月 31日現在)	供給スキーム	備考
1	1-長さ	レーザ波長	633 nm	◎	jc <sub>css</sub> 依頼試験	No.39を統合
2	1-長さ	光周波数	532 nm	◎	依頼試験	
4	1-長さ	ブロックゲージ絶対測定	0.5 mm～ 250 mm	◎	依頼試験	
4-1	1-長さ	ブロックゲージ絶対測定(遠隔校正)	0.5 mm～ 100 mm	◎	依頼試験	
5	1-長さ	長尺ブロックゲージ絶対測定	100 mm～ 1000 mm	◎	依頼試験	
6	1-長さ	ブロックゲージ比較測定	0.5 mm～ 100 mm	◎	依頼試験	JCSS校正事業者にて供給
7	1-長さ	長尺ブロックゲージ比較測定	100 mm～ 1000 mm	◎	依頼試験	JCSS校正事業者にて供給
8	1-長さ	標準尺絶対測定	1000 mmまで	◎	依頼試験	
9	1-長さ	干渉測長器	1 m～ 100 m	◎	依頼試験	
10	1-長さ	距離計	5 m～ 200 m	◎	依頼試験	
11	1-長さ	内径・外径	内径2 mm～ 200 mm、 外径200 mm以下	◎	依頼試験	
12	1-長さ	デジタルスケール(マクロ)	1 m以下	◎	依頼試験	
12-1	1-長さ	デジタルスケール(マイクロ)	1 μm以下	◎	依頼試験	
15	1-長さ	固体屈折率	BK7又は同等品(波長633 nmにおいて 1.51～1.52)	◎	依頼試験	
17	1-長さ	標準尺比較測定	直尺1 mまで、 巻尺100 mまで	◎→●	依頼試験	供給停止
18	2-幾何学量	表面粗さ測定	Ra: 0.1 μm～ 3 μm Rz: 0.5 μm～ 10 μm	◎	依頼試験	
19	2-幾何学量	触針式段差測定	0.5 μm～ 10.0 μm	◎	依頼試験	
20	2-幾何学量	光学式段差測定	0.02 μm～ 0.5 μm	◎	依頼試験	
22	2-幾何学量	AFM方式段差測定	10 nm～ 2.5 μm	◎	依頼試験	
23	2-幾何学量	角度(ロータリーエンコーダ) オートコリメータ: ±5° 多面鏡: 48面以下	ロータリーエンコーダ: 0°～ 360° オートコリメータ: ±5° 多面鏡: 48面以下	◎	jc <sub>css</sub> 依頼試験	No.24を統合
24	2-幾何学量	ポリゴン鏡	24面体以下	◎→●	依頼試験	No.23に統合
25	2-幾何学量	オートコリメータ	±1000 ʹ以下	◎	依頼試験	
26	2-幾何学量	ボールプレート、ホールプレート	700 mm× 700 mm	◎	依頼試験	
27	2-幾何学量	ステップゲージ	0 mm～ 1020 mm	◎	依頼試験	
28	2-幾何学量	ボールバー	0 mm～ 1020 mm	◎	依頼試験	
29	2-幾何学量	CMMによる幾何形状測定	800× 600× 600 mm	◎	依頼試験	
29-1	2-幾何学量	CMM(遠隔校正)	1 m以下	◎	依頼試験	
30	2-幾何学量	平面度	300 mm	◎	依頼試験	
31	2-幾何学量	真直度	1 m	◎→●	依頼試験	供給停止(復帰予定)
32	2-幾何学量	真円度	100 mm以下(器物直径)	◎	依頼試験	
33	2-幾何学量	一次元グレーティング	23 nm～ 8 μm	◎	依頼試験	
33-1	2-幾何学量	面内方向スケール	1目盛り50 nm	◎	依頼試験	
34	2-幾何学量	二次元グレーティング	100 nm～ 8 μm	◎	依頼試験	
35	2-幾何学量	線幅	0.5 mm～ 10 μm	◎	依頼試験	
36	3-時間	周波数(原子発振器)	1 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 100 MHz	◎	jc <sub>css</sub> 依頼試験	
37	3-時間	周波数(商用発振器)	1 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 100 MHz	◎	jc <sub>css</sub> 依頼試験	
37-1	3-時間	周波数(遠隔校正)	5 MHz, 10 MHz	◎	jc <sub>css</sub> 依頼試験	
37-2	3-時間	位相雑音	-100 dBc/Hz、キャリア周波数 10 MHz、オフセット周波数 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz	◎	依頼試験	
38	3-時間	時刻		2014まで		第3期中期計画に移行
39	3-時間	光周波数	200 THz領域(光通信帯)	◎→●	jc <sub>css</sub> 依頼試験	No.11に統合
42-1	3-時間	光周波数	光周波数(広帯域: 500 nm～ 1100 nm、 又は600 THz～ 270 THz)	◎	依頼試験	
43	3-時間	時間		2014まで		第3期中期計画に移行

46-0	4-質量	分銅	1 mg ~ 20 kg	◎	jcss 依頼試験	
46-1	4-質量	高精度分銅 1kg	1 kg	◎	依頼試験	
48	4-質量	分銅	20 kg ~ 5200 kg	◎	依頼試験	
49	4-質量	質量計	(0.01 mg < di, S ≤ 10-6), (di < 0.01 mg, 10-6 < S)	◎	依頼試験	
51	5-力	力計	圧縮: 10 N ~ 20 MN, 引張: 10 N ~ 1 MN	◎	jcss 依頼試験	
53	5-力	一軸試験機	圧縮: 0.1 N ~ 30 MN, 引張: 0.1 N ~ 1 MN	◎	依頼試験	
55	6-トルク	トルクメータ	5 N・m ~ 1 kN・m	◎	jcss 依頼試験	
56	6-トルク	トルクメータ	0.2 kN・m ~ 20 kN・m	◎	jcss 依頼試験	
56-1	6-トルク	トルクメータ		2014まで		第3期中期計画に移行
57	6-トルク	トルクレンチ	5 N・m ~ 1 kN・m	◎	jcss 依頼試験	
58	6-トルク	トルクレンチ	0.2 kN・m ~ 5 kN・m	◎	依頼試験	
58-1	6-トルク	トルクレンチ		2014まで		第3期中期計画に移行
60-0	7-圧力	重錘型圧力標準器	気体ゲージ圧力・気体絶対圧力 (5 kPa ~ 7 MPa)	◎	jcss 依頼試験	
60-1	7-圧力	光波干渉式標準圧力計	気体: ゲージ圧・絶対圧 (1 kPa ~ 120 kPa)	◎	依頼試験	
62	7-圧力	高精度圧力計	気体ゲージ圧力・気体絶対圧力 5 kPa ~ 7 MPa	◎	依頼試験	
63	7-圧力	重錘型圧力標準器	液体圧力 1 MPa ~ 500 MPa	◎	jcss 依頼試験	
64	7-圧力	重錘型圧力標準器	液体圧力 1 MPa ~ 500 MPa ( ~ 1 GPa)	◎	依頼試験	
65	7-圧力	高精度圧力計	液体圧力 1 MPa ~ 500 MPa	◎	依頼試験	
66-0	7-圧力	高精度圧力計	液体圧力 ~ 1 GPa	◎	依頼試験	No.66-1を統合
66-1	7-圧力	超高圧力標準		●		No.66-0に統合
67	7-圧力	低圧力標準/低圧力計	気体差圧 [ライン圧: 100 kPa abs] 1 Pa ~ 10 kPa	◎	依頼試験	
68-0	7-圧力	低圧力標準/低圧力計	絶対圧力 1 kPa ~ 10 kPa	◎	依頼試験	
68-1	8-重力加速度	重力加速度	9.8 m/s <sup>2</sup>	◎	依頼試験	
69	9-真空	真空計	0.1 mPa ~ 10 Pa (SRG) 0.1 Pa ~ 2 kPa (DG)	◎	jcss 依頼試験	
70	9-真空	真空計	0.1 mPa ~ 1 μPa	◎	依頼試験	No.71を統合後、範囲変更
71	9-真空	真空計		●		No.70に統合
72	9-真空	分圧計	2x10 <sup>-9</sup> Pa ~ 1x10 <sup>-4</sup> Pa (N <sub>2</sub> , Ar, He, H <sub>2</sub> )	◎	依頼試験	
73	9-真空	標準リーク	1x10 <sup>-8</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s ~ 1x10 <sup>-6</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s (He)	◎	依頼試験	
74-0	10-流量	気体小流量(秤量法・PVTt 法)	0.0003 m <sup>3</sup> /h ~ 5 m <sup>3</sup> /h, 50 ~ 300 kPa, (0.005 g/min ~ 180 g/min, N <sub>2</sub> )	◎	jcss 依頼試験	
74-1	10-流量	気体小流量(比較法)	0.0003 m <sup>3</sup> /h ~ 5 m <sup>3</sup> /h, 100 kPa, (0.005 g/min ~ 180 g/min, N <sub>2</sub> )	◎	依頼試験	
75	10-流量	気体中流量(PVTt法)	5 m <sup>3</sup> /h ~ 200 m <sup>3</sup> /h, 100 kPa ~ 500 kPa	◎	jcss 依頼試験	
76-1	10-流量	気体中流量(音速ノズル比 較法)	5 m <sup>3</sup> /h ~ 200 m <sup>3</sup> /h, 大気圧	◎	依頼試験	
76-2	10-流量	気体中流量(閉ループ法)	25 m <sup>3</sup> /h ~ 1000 m <sup>3</sup> /h, 100 kPa ~ 500 kPa	◎	依頼試験	
76-3	10-流量	気体中流量(常圧法)	5 m <sup>3</sup> /h ~ 200 m <sup>3</sup> /h, 大気圧	◎	依頼試験	
78	10-流量	液体小流量	0.002 m <sup>3</sup> /h ~ 1 m <sup>3</sup> /h	◎	jcss 依頼試験	
79	10-流量	液体中流量	0.3 m <sup>3</sup> /h ~ 50 m <sup>3</sup> /h	◎	jcss 依頼試験	
80	10-流量	液体大流量	50 m <sup>3</sup> /h ~ 3000 m <sup>3</sup> /h	◎	jcss 依頼試験	
82	10-流量	微風速	0.05 m/s ~ 1.5 m/s	◎	jcss 依頼試験	
83-0	10-流量	気体中流速(レーザドップラ 流速計)	1.3 m/s ~ 40 m/s	◎	jcss 依頼試験	
83-1	10-流量	気体中流速(超音波流速 計)	1.3 m/s ~ 40 m/s	◎	jcss 依頼試験	
86	10-流量	石油小流量(軽油、灯油)	0.01 m <sup>3</sup> /h ~ 0.1 m <sup>3</sup> /h	◎	依頼試験	
87	10-流量	石油中流量(軽油、灯油)	0.1 m <sup>3</sup> /h ~ 6 m <sup>3</sup> /h	◎	jcss 依頼試験	
88	10-流量	石油大流量(軽油、灯油)	3 m <sup>3</sup> /h ~ 300 m <sup>3</sup> /h	◎	jcss 依頼試験	
93	11-密度	固体密度標準	シリコン単結晶 2320 kg/m <sup>3</sup> ~ 2340 kg/m <sup>3</sup>	◎	jcss 依頼試験	
93-1	11-密度	固体密度標準	密度差: 0 kg/m <sup>3</sup> ~ 0.035 kg/m <sup>3</sup> 質量: 5 g ~ 1010 g	◎	依頼試験	
94	11-密度	固体密度標準	密度: 800 kg/m <sup>3</sup> ~ 20000 kg/m <sup>3</sup> 質量: 30 g ~ 1010 g	◎	依頼試験	
95	11-密度	密度浮ひょう	600 kg/m <sup>3</sup> ~ 2000 kg/m <sup>3</sup>	◎	依頼試験	

96	11-密度	密度標準液	有機液体 600 kg/m <sup>3</sup> ~ 1700 kg/m <sup>3</sup>	◎	依頼試験	
97	11-密度	密度標準液		●		環境に配慮し中止(水銀密度)
98	11-密度	PVT性質	圧力:0 MPa~5 MPa 密度:0 kg/m <sup>3</sup> ~ 1700 kg/m <sup>3</sup>	◎	依頼試験	
98-1	11-密度	液体の屈折率	屈折率標準液 屈折率1.1 以上	◎	依頼試験	
100	12-粘度	粘度標準液	1 mPa·s ~ 500 Pa·s、常温	◎	依頼試験	
101	12-粘度	粘度標準液	1 mPa·s ~ 500 Pa·s、-40 °C ~ 100 °C	◎	依頼試験	
102	13-体積	体積計(衡量法)	体積タンク ピュレット・フラスコ	◎	依頼試験	
103	14-音響	音圧感度(標準マイクロホン)	20 Hz ~ 20 kHz	◎	jcoss	
103-1	14-音響	音圧レベル(音響校正器)	125 Hz ~ 1 kHz	◎	依頼試験	
105	14-音響	音場感度(計測用マイクロホン)	20 Hz ~ 20 kHz	◎	依頼試験	
105-1	14-音響	音圧感度(計測用マイクロホン)	1 Hz ~ 20 Hz	◎	依頼試験	
105-2	14-音響	音場感度(計測用マイクロホン)	20 kHz ~ 100 kHz	◎	依頼試験	
105-3	14-音響	音場レスポンスレベル(サウンドレベルメータ)	20 Hz ~ 12.5 kHz	◎	依頼試験	
106	15-超音波	超音波パワー	1mW ≤ P ≤ 15W (0.5MHz ≤ f ≤ 15MHz) 1mW ≤ P ≤ 500mW (15MHz < f ≤ )	◎	依頼試験	
106-1	15-超音波	超音波パワー	0.5MHz ~ 5 MHz 15 W ~ 70 W	2014まで	依頼試験	第3期中期計画に移行
107	15-超音波	音場感度(ハイドロホン)	0.5 MHz ~ 20 MHz	◎	依頼試験	
107-1	15-超音波	超音波音場パラメータ	0.5 MHz ~ 20 MHz	◎	依頼試験	
108	16-振動加速	低周波振動加速度	0.1Hz ~ 2 Hz	◎	jcoss 依頼試験	
109	16-振動加速	低周波振動加速度	1 Hz ~ 200 Hz	◎	jcoss 依頼試験	
110	16-振動加速	中周波振動加速度	20 Hz ~ 5 kHz(電圧感度、電荷感度)	◎	jcoss 依頼試験	
111	16-振動加速	高周波振動加速度	5 kHz ~ 10 kHz(電圧感度、電荷感度)	◎	jcoss 依頼試験	
112	17-衝撃加速	衝撃加速度	200 m/s <sup>2</sup> ~ 5000 m/s <sup>2</sup> (電圧感度)	◎	依頼試験	No.113を統合後範囲拡張
113	17-衝撃加速	衝撃加速度		●		No.112に統合
114	18-音速	音速標準物質	室温 ~ 500 °C	◎→●		供給停止
115	18-音速	音速標準物質	500 °C ~ 1000 °C	◎→●		供給停止
116	19-直流・低周	ジョセフソン接合アレー電圧標準	1 V	◎	jcoss 依頼試験	
117	19-直流・低周	電子式標準電圧発生器	1 V, 1.018 V, 10 V	◎	jcoss 依頼試験	
118	19-直流・低周	(直流)分圧器	1 kV/10 V, 100 V/10 V	◎→●	依頼試験(特殊)	供給停止
118-1	19-直流・低周	直流電圧計(多点)	-12Vから-1.2V, 1.2Vから12Vにおいて約1Vおき	◎	依頼試験	
120	19-直流・低周	抵抗器	1mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 25 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ, 1 GΩ, 10 GΩ, 100 GΩ, 1 TΩ	◎	jcoss 依頼試験	No.121,122を統合
121	19-直流・低周	抵抗器	1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ, 1 GΩ, 10 GΩ, 100 GΩ, 1 TΩ	◎→●	jcoss 依頼試験	
121-1	19-直流・低周	テラオームメータ	1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ, 1 GΩ, 10 GΩ, 100 GΩ, 1 TΩ	◎	jcoss 依頼試験	
122	19-直流・低周	抵抗器	1mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ	◎→●	jcoss 依頼試験	
123-0	19-直流・低周	キャパシタ	100 pF/ 1.592 kHz, 1 kHz	◎	jcoss 依頼試験	No.123-2-1を統合
123-1	19-直流・低周	キャパシタ	10 pF/1.592 kHz, 1 kHz	◎	jcoss 依頼試験	
123-2	19-直流・低周	キャパシタ	1000 pF/ 1.592 kHz, 1 kHz	◎	jcoss 依頼試験	
123-2-1	19-直流・低周	キャパシタ		●		No.123-0に統合
123-3	19-直流・低周	キャパシタ	0.01 μF, 0.1 μF, 1 μF/ 1 kHz, 1.592 kHz; 10 μF/1 kHz	◎	依頼試験	
123-4	19-直流・低周	キャパシタ	100 μF/ 60 Hz, 120 Hz, 1 kHz	◎	依頼試験	
124-0	19-直流・低周	誘導分圧器	0.1 ~ 1.0; 10 V/ 1 kHz	◎	jcoss 依頼試験	
124-1	19-直流・低周	誘導分圧器		◎→●	依頼試験	No.124-1-1に統合
124-1-1	19-直流・低周	誘導分圧器	0.05 ~ 1.0; 100 V/ 50, 60 Hz 0.1 ~ 1.0; 10 V/ 120 Hz	◎	jcoss 依頼試験	No.124-1を統合
124-2	19-直流・低周	誘導分圧器	0.1 ~ 1.0; 10 V/ 200 Hz, 400 Hz, 10 kHz	◎	依頼試験	
124-3	19-直流・低周	誘導分圧器	0.1 ~ 1.0; 10 V/ 100 kHz	◎	依頼試験	
124-4	19-直流・低周	誘導分圧器		●		No.124-1-1に統合して整理
125-0	19-直流・低周	交流抵抗器	10 Ω, 100 Ω, 1kΩ, 10 kΩ, 100kΩ/1 kHz, 10 kΩ/10 kHz	◎	jcoss 依頼試験	No.125-0-1を統合

125-0-1	19-直流・低周	交流抵抗器		●		No.125-0に統合
125-1	19-直流・低周	キャパシタの損失係数(tan δ)	10 pF, 100 pF, 1000 pF/1kHz, 1.592 kHz	◎	jc css 依頼試験	No.125-2を統合
125-2	19-直流・低周	キャパシタの損失係数(tan δ)		●		No125-1に統合
125-3	19-直流・低周	キャパシタの損失係数(tan δ)	0.01 μF, 0.1 μF, 1 μF/ 1 kHz, 1.592 kHz; 10 μF/1 kHz	◎	依頼試験	
125-4	19-直流・低周	キャパシタの損失係数(tan δ)	100 μF/ 60 Hz, 120 Hz, 1 kHz	◎	依頼試験	
126	19-直流・低周	インダクタ	10 mH/1 kHz, 1.592 kHz 100 mH/ 1 kHz	◎	依頼試験	
127-0	19-直流・低周	交直変換器(基本範囲)	2 V~20 V, 10 mA, 10 Hz~1 MHz	◎	jc css 依頼試験	
127-0-1	19-直流・低周	交直変換器(遠隔校正)	6 V, 1 kHz (e-trace)	◎	依頼試験	
127-1	19-直流・低周	交直変換器(高電圧)	20 V ~ 1 kV, 10 Hz ~ 100 kHz	◎	jc css 依頼試験	
127-1-1	19-直流・低周	交直変換器(低電圧)	10 mV~2 V, 10 Hz~100 kHz	◎	jc css 依頼試験	
127-2	19-直流・低周	交直変換器(高周波)	1 V, 1MHz~50 MHz	◎	依頼試験	
127-2-1	19-直流・低周	交流電圧	10 V, 40 Hz~100 kHz	◎	依頼試験	
127-3	19-直流・低周	交流電流比較器(商用周波数)	50 A以下, 10000/1~1/1, 45 Hz~65 Hz	◎	jc css 依頼試験	
127-3a	19-直流・低周	交流電流比較器(倍周波数)	50 A以下, 10000/1~1/1, 120 Hz	◎	jc css 依頼試験	
127-3c	19-直流・低周	交流電流比較器(航空周波数)	50 A以下, 10000/1~1/1, 200 Hz, 400 Hz	◎	依頼試験	
127-3d	19-直流・低周	交流電流比較器(1kHz領域)	5 A以下, 100/1~1/1, 700, 1000 Hz	◎	依頼試験	
127-4	19-直流・低周	交流電力	100 V/5 A / 45 Hz~65 Hz / pf 1, ±0.866, ±0.5, ±0 100 V/5 A / 100 Hz~400 Hz	◎→●	依頼試験	供給停止
127-5	19-直流・低周	交流電力量	100V, 110V/5A, 45Hz~65Hz 力率:1, 0.866, 0.5	◎→●		JEMICに統合
127-7	19-直流・低周	交流シャント	0.1 Ω /5A/45Hz~65Hz, 400Hz	◎	依頼試験	
128	19-直流・低周	電子式キャリブレータ	(1 V~10 V) (直流電圧)	◎		(JEMICが供給)
129	19-直流・低周	デジタルマルチメータ	(1 V~10 V) (直流電圧)	◎		(JEMICが供給)
130	19-直流・低周	デジタルマルチメータ	(1 mΩ ~ 100 kΩ) (直流抵抗)	◎		(JEMICが供給)
131	19-直流・低周	電子式キャリブレータ	(100 A 以下) (直流電流)	◎		(JEMICが供給)
132	19-直流・低周	デジタルマルチメータ	(100 A 以下) (直流電流)	◎		(JEMICが供給)
133	19-直流・低周	電子式キャリブレータ	(1 MHz以下・1 kV以下、45 Hz~65 Hz・20 A以下)	◎		(JEMICが供給)
134	19-直流・低周	デジタルマルチメータ	(1 MHz以下・1 kV以下、45 Hz~65 Hz・20 A以下)	◎		(JEMICが供給)
135	19-直流・低周	標準抵抗器	(1 mΩ ~ 100 kΩ)	◎		(JEMICが供給)
136	19-直流・低周	抵抗測定装置	(1 mΩ ~ 100 kΩ)	◎		(JEMICが供給)
137	19-直流・低周	標準分流器	(100 A以下)	◎		(JEMICが供給)
138	19-直流・低周	交直変換器	(電圧: 1 MHz以下・1 kV以下、電流: 45 Hz~65 Hz・20 A以下)	◎		(JEMICが供給)
139	19-直流・低周	交流電圧	(1 MHz以下・1 kV以下)	◎		(JEMICが供給)
140	19-直流・低周	交流電流	(45 Hz~65 Hz, 20 A以下)	◎		(JEMICが供給)
141	19-直流・低周	交流電力	(45 Hz~65 Hz, 110 V以下, 50 A以下)	◎		(JEMICが供給)
142	19-直流・低周	交流電力量	(45 Hz~65 Hz, 110 V以下, 5 A以下)	◎		(JEMICが供給)
143	19-直流・低周	直流高電圧	(100 kV以下)	◎		(JEMICが供給)
144	19-直流・低周	交流高電圧	(550/√3 kV以下)	◎		(JEMICが供給)
145	19-直流・低周	交流大電流	(40 kA以下)	◎		(JEMICが供給)
146	20-高周波	高周波電圧(同軸)	10 MHz ~ 1 GHz, 0.5 V	◎	jc css 依頼試験	
148-0	20-高周波	高周波電力(同軸)	10 MHz ~ 18 GHz, 1 mW, 10 mW	◎	jc css 依頼試験	
148-0-1	20-高周波	高周波電力(同軸、10 MHz以下)	7 mm同軸10 MHz以下 (100, 200, 500, 700, 1000) kHz, 1 mW	◎	依頼試験	
148-0-2	20-高周波	高周波電力(同軸、絶対電力)	7 mm同軸50 MHz, 1 mW	◎	依頼試験	
148-0-3	20-高周波	高周波電力(同軸、大電力)		●		認定事業者が拡張により対応
148-1	20-高周波	高周波電力(2.9 mm同軸)	10 MHz ~ 50 GHz; 10 mW, 1 mW	◎	jc css 依頼試験	
148-2	20-高周波	高周波電力(3.5 mm同軸)	1 mW, PC 3.5 同軸パワーセンサ、10 MHz~26.5 GHz	◎	依頼試験	
151	20-高周波	高周波電力(導波管)	10 GHz, 10 mW	◎	依頼試験	
152	20-高周波	高周波電力(導波管)ミリ波	50 GHz~75 GHz, 1mW 75 GHz~110 GHz, 0.1 mW	◎	依頼試験	

153	20-高周波	高周波減衰量(ピストン減衰器)	30 MHz: ~100 dB(挿入損失を含む)	◎	jc css 依頼試験	
154	20-高周波	高周波減衰量(同軸)	10 MHz: ~50 dB; 10 MHz~12 GHz	◎		(JQAが供給)
155	20-高周波	高周波減衰量(同軸)	可変減衰器: (0.01, 0.03, 0.06, 0.1, 0.5, 1, 3, 5, 10, 12)	◎	jc css 依頼試験	
155-1	20-高周波	高周波減衰量・位相量(同軸)		2014まで		第3期中期計画に移行
155-2	20-高周波	高周波減衰量(同軸)	可変減衰器: 100 kHz~10 MHz, 100 dB以下	◎	依頼試験	
156-0	20-高周波	高周波減衰量(同軸)	可変減衰器: (18~40) GHz, 60 dB以下 固定減衰器: (18~40) GHz, 60 dB以	◎	jc css 依頼試験	
156-1	20-高周波	高周波減衰量(導波管)	18~40 GHz ~60 dB	◎	依頼試験	
157	20-高周波	高周波インピーダンス(同軸、PC-7)	0.04 GHz ~ 18 GHz	◎	jc css 依頼試験	
157-1	20-高周波	高周波インピーダンス(同軸、PC-7)	9 kHz ~ 30 MHz	◎	jc css 依頼試験	
157-1-1	20-高周波	高周波インピーダンス(同軸、PC-7)、機械特性インピーダ	特性インピーダンス50 Ω, 1 GHz	◎	依頼試験	
157-2	20-高周波	高周波インピーダンス(同軸、TypeN50)	0.04 GHz ~ 18 GHz	◎	jc css 依頼試験	
157-3	20-高周波	高周波インピーダンス(同軸、TypeN50)	30 kHz ~ 1 GHz	◎	依頼試験	
157-4	20-高周波	高周波インピーダンス(同軸、TypeN75)	0.04 GHz ~ 3 GHz	◎	依頼試験	
157-5	21-高周波	高周波インピーダンス(同軸、TypeN75)		2014まで		第3期中期計画に移行
158-0	20-高周波	高周波インピーダンス(同軸、PC-3.5)	0.1 GHz ~ 33 GHz	◎	jc css 依頼試験	
158-0-1	20-高周波	高周波インピーダンス(同軸、PC-3.5)	30 kHz ~ 1 GHz	◎	依頼試験	
158-1	20-高周波	高周波インピーダンス(導波管)		2014まで		第3期中期計画に移行
158-2	20-高周波	高周波インピーダンス(導波管)		2014まで		第3期中期計画に移行
159-0	20-高周波	高周波雑音(同軸)	2 GHz ~ 18 GHz; 150 K ~ 12000 K	◎	jc css 依頼試験	No.159-0-1を統合
159-0-1	20-高周波	高周波雑音(同軸)		●		No.159-0に統合
159-1	20-高周波	高周波雑音(同軸)	10 MHz - 26.5 GHz; 290 K - 1000000 K	◎	依頼試験	
160	20-高周波	高周波雑音(導波管)	18 GHz~26.5GHz; 77 K - 12000 K	◎	依頼試験	
161-0	20-高周波	電磁界強度(ホーン、電波暗室、PFDプローブ)	1.7 GHz~ 4 GHz(2バンド、5周波数)	◎	依頼試験	
161-1	20-高周波	電磁界強度(ホーン、電波暗室)		2014まで		第3期中期計画に移行
161-2	20-高周波	電磁界強度(GTEMセル、PFDプローブ)		2014まで		第3期中期計画に移行
162	20-高周波	アンテナ係数(微小アンテナ(ループ))	ループアンテナ直径10cm 150 kHz ~ 30 MHz	◎	依頼試験	
162-1	20-高周波	アンテナ係数(微小アンテナ(モノポール))		2014まで		第3期中期計画に移行
163	20-高周波	アンテナ係数(ダイポールアンテナ、標準オープンサイ	30 MHz ~ 1 GHz	◎	jc css 依頼試験	
163-1	20-高周波	アンテナ係数(ダイポールアンテナ、自由空間)	1 GHz ~ 2 GHz	◎	依頼試験	
164	22-高周波	アンテナ係数(ログペリアンテナ)	300 MHz ~ 1 GHz	◎	依頼試験	
164-1	20-高周波	アンテナ係数(バイコニカルアンテナ)	30 MHz ~ 300 MHz	◎	依頼試験	
164-2	20-高周波	アンテナ係数(パイログアンテナ)		2014まで		第3期中期計画に移行
165-0	20-高周波	利得・偏波分離度(ホーンアンテナ、電波暗室、ニアフィールド走査システム)	ホーンアンテナ利得 1GHz~ 40 GHz (10バンド21周波数)	◎	依頼試験	
165-1	20-高周波	利得・偏波分離度(ホーンアンテナ、電波暗室、ニアフィールド走査システム)		2014まで		第3期中期計画に移行
166	20-高周波	レーザーパワー	633 nm, 50 μW ~ 10 mW	◎	jc css 依頼試験	
167		レーザーパワー(光ファイバパワー)	(857 nm, 10 μW~200 μW), (1.3 μm, 1.55 μm, 1.6 μm, 10 μW~10 mW)	◎		(JQAが供給)
167-0-1	20-高周波	光ファイバパワー	852 nm, 1.3 μm, 1.55 μm; 50 μW ~ 1 mW	◎	依頼試験	
167-1	20-高周波	レーザーパワー	(488 nm, 515 nm, 10 mW~1 W), (404 nm, 1.55 μm, 50 μW~1 mW)	◎	jc css 依頼試験	
168		レーザーパワー	(404.2 nm, 10 μW~5 mW), (409.0 nm, 10 μW~1 mW), (488.0 nm, 514.5 nm, 10 μW~1 W), (632.8 nm, 10 μW~10 mW), (663.2 nm, 10 μW~7 mW), (788.1 nm, 834.8 nm, 1302.0 nm, 10 μW~3 mW), (1064 nm, 10 mW~1 W), (1549.6 nm, 10 μW~5 mW)	◎		(JQAが供給)

169	20-高周波	レーザーパワー	10.6 μm; 1 W ~ 100 W	◎	依頼試験	
169-1	20-高周波	レーザーパワー	1.1 μm, 1 W ~ 100 W	◎	依頼試験	
170-0	20-高周波	レーザーエネルギー(パルス)	1.06 μm, 532 nm, 355 nm, 266 nm, 1 mJ ~ 100 mJ (パルスエネルギー), 10 mW ~ 1 W (平均パワー)	◎	依頼試験	No.170-0-1を統合
170-0-1	20-高周波	レーザーエネルギー(パルス)		●		No.170-0-1に統合
170-1	20-高周波	光ファイバ減衰量	1310 nm, 1550 nm, 9 dB ~ 90 dB, 852 nm, 10 dB ~ 60 dB (基準レベル 1mW)	◎	jc css 依頼試験	
170-2	20-高周波	光ファイバ減衰量	1550 nm, 3 dB ~ 30 dB (基準レベル1 W), 1465 nm, 0 dB ~ 24 dB (基準レベル250 mW)	◎	依頼試験	
171	21-測光量・放	光度(白熱電球)	10 cd ~ 3000 cd	◎	jc css 依頼試験(特)	
171-1	21-測光量・放	光度(LED)	砲弾型 1 cd ~ 10 cd	◎	依頼試験(特 殊)	
172	21-測光量・放	分布温度	2000 K ~ 3400 K	◎	jc css 依頼試験(特)	
173	21-測光量・放	全光束(白熱電球)	5 lm ~ 9000 lm	◎	jc css 依頼試験(特)	
173-1	21-測光量・放	全光束(LED)	0.1 lm ~ 10 lm	◎	依頼試験(特 殊)	
174	21-測光量・放	照度(白熱電球)	1 lx ~ 3000 lx	◎	jc css 依頼試験(特)	
174-1	21-測光量・放	照度(照度応答度)	1 lx ~ 3000 lx (2856 K)	◎	jc css 依頼試験	
175	21-測光量・放	分光放射照度(紫外, 可視, 赤外)	250 nm ~ 2500 nm	◎	jc css 依頼試験(特)	
175-1	21-測光量・放	分光放射照度(紫外)	200 ~ 400 nm	◎	jc css 依頼試験	
176	21-測光量・放	分光放射輝度(紫外, 真空紫外)	160 nm ~ 300 nm	◎	依頼試験	
177	21-測光量・放	分光拡散反射率(可視域)	360 nm ~ 830 nm (反射率レベル 100 % ~ 1 %)	◎	依頼試験	No.177-1を統合後、範囲変更
177-1	21-測光量・放	分光拡散反射率(紫外域)		2014まで		第3期中期計画に移行
177-2	21-測光量・放	分光拡散反射率(赤外域)	830 nm ~ 1600 nm	◎	依頼試験	
178-0	21-測光量・放	分光透過率	440 nm ~ 800 nm	◎	依頼試験(特 殊)	No.178-1を統合
178-1	21-測光量・放	分光透過率		●		No.178-0に統合
179-0	21-測光量・放	分光応答度(真空紫外, 紫外)	140 nm ~ 300 nm	◎	依頼試験	
179-1	21-測光量・放	分光応答度(真空紫外)	10 nm ~ 90 nm	◎	依頼試験	
180	21-測光量・放	分光応答度(紫外, 可視, 近赤外)	250 nm ~ 1150 nm (Si) 800 nm ~ 1650 nm (InGaAs)	◎	jc css 依頼試験	
180-1	21-測光量・放	分光応答度(高精度)	レーザー波長点(Si-PD: 可視域離散波長, 700 nm ~ 950 nm, InGaAs: 1310 nm, 1550 nm)	◎	依頼試験	
180-2	21-測光量・放	アパーチャ開口面積(放射測定用)	20 mm <sup>2</sup> ~ 540 mm <sup>2</sup>	◎	依頼試験	
181	22-放射線	軟X線空気カーマ(&照射線量)	管電圧10 kV ~ 50 kV	◎	jc css 依頼試験	
182	22-放射線	中硬X線空気カーマ(&照射線量)	管電圧30 kV ~ 300 kV	◎	jc css 依頼試験	
184	22-放射線	γ線空気カーマ(&照射線量)	3 nGy ~ 28 mGy	◎	jc css 依頼試験	
185	22-放射線	大γ線空気カーマ(&照射線量)	1 μGy ~ 2.7 kGy	◎	jc css 依頼試験	
186	22-放射線	水吸収線量	Co-60: 0.1 Gy ~ 220 Gy	◎	jc css 依頼試験	
187-0	22-放射線	β線吸収線量	<sup>90</sup> Sr/ <sup>90</sup> Y 0.11 mGy ~ 40 mGy <sup>85</sup> Kr 0.38 mGy ~ 0.14 Gy	◎	jc css 依頼試験	
187-1	22-放射線	放射光軟X線フルエンス	90 eV ~ 3.9 keV	◎	依頼試験	
188	23-放射能	γ線核種放射能	100 kBq/g ~ 400 MBq/g	◎	jc css 依頼試験	
189	23-放射能	γ(X)線放出率	2 ks <sup>-1</sup> ~ 4 Ms <sup>-1</sup>	◎	jc css 依頼試験	
190	23-放射能	環境レベル放射能標準	20 Bq/g ~ 400 kBq/g	◎	依頼試験	
190-1	23-放射能	放射性ガス	1 Bq/cm <sup>3</sup> ~ 2 kBq/cm <sup>3</sup>	2014まで	依頼試験	第3期中期計画に移行
191	23-放射能	純α, β核種放射能	20 Bq/g ~ 400 MBq/g	◎	jc css 依頼試験	
192	23-放射能	放射能面密度	0.3 Bq/cm <sup>2</sup> ~ 1 MBq/cm <sup>2</sup>	◎	依頼試験	
193	23-放射能	荷電粒子放出率	20 s <sup>-1</sup> ~ 200 ks <sup>-1</sup>	◎	jc css 依頼試験	
194	24-中性子	中性子放出率:252Cf	10 <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ~ 10 <sup>7</sup> s <sup>-1</sup>	◎	jc css 依頼試験	
195	24-中性子	中性子放出率Am-Be	10 <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ~ 10 <sup>7</sup> s <sup>-1</sup>	◎	jc css 依頼試験	

196	24-中性子	熱中性子フルエンス率	$5 \times 10^5 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1} \sim 10^8 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$	◎	jc ss 依頼試験	
197	24-中性子	速中性子フルエンス	$10^7 \text{ m}^{-2} \sim 10^{11} \text{ m}^{-2}$ (144 keV, 565 keV, 5.0 MeV, 14.8 MeV)	◎	jc ss 依頼試験	
198	24-中性子	中速中性子フルエンス	$10^7 \text{ m}^{-2} \sim 10^9 \text{ m}^{-2}$ ; 10 keV~50 keV	◎	jc ss 依頼試験	
199	24-中性子	速中性子フルエンス	$10^7 \text{ m}^{-2} \sim 10^{10} \text{ m}^{-2}$ ; 5.0 MeV~8.5 MeV	◎	jc ss 依頼試験	
200	24-中性子	速中性子フルエンス		2014まで		第3期中期計画に移行
201-1	24-中性子	連続スペクトル中性子フル エンス:252Cf	$10^7 \text{ m}^{-2} \sim 10^{11} \text{ m}^{-2}$	◎	jc ss 依頼試験	
201-2	24-中性子	連続スペクトル中性子フル エンス:Am-Be	$10^7 \text{ m}^{-2} \sim 10^{11} \text{ m}^{-2}$	◎	jc ss 依頼試験	
202	25-温度	温度定点	-39 °C 水銀点	◎	jc ss 依頼試験	
203	25-温度	温度定点	0.01 °C 水の三重点	◎	jc ss 依頼試験	
204	25-温度	温度定点	156 °C インジウム点	◎	jc ss 依頼試験	
205	25-温度	温度定点	232 °C スズ点	◎	jc ss 依頼試験	
206	25-温度	温度定点	420 °C 垂鉛点	◎	jc ss 依頼試験	
207	25-温度	ステム型白金抵抗温度計	660 °C アルミニウム点	◎	jc ss 依頼試験	
208	25-温度	ステム型白金抵抗温度計	962 °C 銀点	◎	jc ss 依頼試験	
208-1	25-温度	ステム型白金抵抗温度計		●		No.216-0に統合して整理
209-1	25-温度	極低温抵抗温度計		2014まで		第3期中期計画に移行
209-2	25-温度	ロジウム鉄抵抗温度計	0.65 K~ 3.2 K	◎	jc ss 依頼試験	
209-3	25-温度	ロジウム鉄抵抗温度計	2.2 K~ 4.2 K	◎	jc ss 依頼試験	
210	25-温度	ロジウム鉄抵抗温度計	4.2 K ~ 24 K	◎	jc ss 依頼試験	
211	25-温度	カプセル型白金抵抗温度計	84 K~273 K	◎	jc ss 依頼試験	
211-1	25-温度	カプセル型白金抵抗温度計	54 K~ 84 K	◎	jc ss 依頼試験	
211-2	25-温度	カプセル型白金抵抗温度計	25 K~54 K	◎	jc ss 依頼試験	
211-3	25-温度	カプセル型白金抵抗温度計	14K~25K	◎	jc ss 依頼試験	
211-4	25-温度	カプセル型白金抵抗温度計	ガリウムの三重点(29.7666°C)	◎	jc ss 依頼試験	
212	25-温度	ステム型白金抵抗温度計	アルゴン点84 K (比較校正)	◎	jc ss 依頼試験	
213	25-温度	ステム型白金抵抗温度計	-40 °C~ 420 °C	◎	jc ss 依頼試験	
214	25-温度	ステム型白金抵抗温度計	420 °C~ 962 °C	◎	jc ss 依頼試験	
215	25-温度	温度定点物質		●		No.220に統合して整理
216-0	25-温度	貴金属熱電対	1085 °C: 銅点校正	◎	jc ss 依頼試験	
216-1	25-温度	貴金属熱電対	962 °C: 銀点校正	◎	jc ss 依頼試験	
216-2	25-温度	貴金属熱電対	660 °C: アルミニウム点校正	◎	jc ss 依頼試験	
216-3	25-温度	貴金属熱電対	420 °C: 垂鉛点校正	◎	jc ss 依頼試験	
217	25-温度	貴金属熱電対	1324 °C(共晶点校正)	◎	jc ss 依頼試験	
219	25-温度	貴金属熱電対: 定点校正	0 °C~ 1100 °C:	◎	jc ss 依頼試験	
220	25-温度	貴金属熱電対	1553 °C: パラジウム点校正	◎	jc ss 依頼試験	
221	25-温度	ガラス製温度計	-50 °C~350 °C	◎	jc ss 依頼試験	
222	25-温度	定点黒体装置	垂鉛点: 419.527 °C	◎	jc ss 依頼試験	
223	25-温度	定点黒体装置	アルミニウム点: 660.323 °C	◎	jc ss 依頼試験	
224	25-温度	定点黒体装置	銀点: 961.78 °C	◎	jc ss 依頼試験	
225	25-温度	定点黒体装置	銅点:1084.62 °C	◎	jc ss 依頼試験	
225-1	25-温度	定点黒体装置	金属炭素共晶点 (Re-C(2474°C), Pt-C (1738°C), Pd-C (1492°C), Co-C (1324°C), Fe-C (1153°C), Cu(1084.62°C)),	◎	jc ss 依頼試験	
227	25-温度	比較黒体炉	-30 °C~ 0 °C	◎	jc ss 依頼試験	
228-0	25-温度	比較黒体炉	0 °C~ 100 °C	◎	jc ss 依頼試験	
228-1	25-温度	比較黒体炉	耳式体温計校正用 (35 °C~ 42 °C)	◎	jc ss 依頼試験	
229	25-温度	比較黒体炉	100 °C~400 °C	◎	jc ss 依頼試験	

230	25-温度	放射温度計	400 °C ~ 2000 °C, 0.9 mm	◎	jcss 依頼試験	
231-0	25-温度	放射温度計	962 °C ~ 2000 °C, 0.65 mm	◎	jcss 依頼試験	
232	26-湿度	露点計	露点 -10 ~ +95 °C	◎	jcss 依頼試験	
233	26-湿度	露点計	露点 -10 ~ +23 °C	◎	jcss 依頼試験	
234	26-湿度	露点計	露点 -70 ~ -10 °C	◎	jcss 依頼試験	
235-0	26-湿度	微量水分発生装置	物質分子量 12 nmol/mol ~ 1200 nmol/mol (大気圧での露点 -100 °C ~ -75 °C 相当)	◎	依頼試験	
235-1	26-湿度	相対湿度計	相対湿度 10 % ~ 95 % @23 °C	◎	依頼試験	
235-2	26-湿度	露点計		●		No.232に統合して整理
236	27-固体物性	熱膨張率測定 / 標準物質	校正実施温度: 20 K ~ 300 K CRM: 単結晶シリコン	◎	依頼試験 標準物質	
237	27-固体物性	熱膨張率測定 / 標準物質	校正実施温度: 293 K ~ 1000 K RM: 単結晶シリコン	◎	依頼試験 標準物質	
237-1	27-固体物性	標準物質	RM: ガラス状炭素(2種類) 適用温度: 293 K ~ 1600 K	◎	標準物質	
238	27-固体物性	熱膨張率測定	校正実施温度: 5 °C ~ 35 °C	◎	依頼試験	
240	27-固体物性	熱拡散率測定 / 熱拡散率標準物質	校正実施温度: 300 K ~ 1200 K CRM: 等方性黒鉛	◎	依頼試験 標準物質	
241	27-固体物性	熱拡散率測定 / 熱拡散率標準物質	校正実施温度: 1200 K ~ 1500 K CRM: 等方性黒鉛	◎	依頼試験 標準物質	
242	27-固体物性	薄膜熱拡散時間測定	熱拡散時間 0.1 ns ~ 6.5 ns の金属単層薄膜	◎	依頼試験	
242-1	27-固体物性	薄膜熱拡散時間測定 / 薄膜熱拡散時間標準物質	40 ns ~ 1000 ns RM: 窒化チタン薄膜; 140 ns	◎	依頼試験 標準物質	
243	27-固体物性	熱伝導率 / 熱拡散率標準物質		●		No.244に統合
244	27-固体物性	熱伝導率標準物質	RM: 等方性黒鉛 適用温度: 300 K ~ 900 K	◎	標準物質	No.243を統合
245	27-固体物性	比熱容量測定 / 標準物質	校正実施温度: 50 K ~ 350 K CRM: 単結晶シリコン	◎	依頼試験 標準物質	
246	27-固体物性	比熱容量測定	校正実施温度: 300 K ~ 900 K	◎	依頼試験	
252	28-硬さ	ロックウェル硬さ(試験機、標準片)	20 ~ 65 HRC	◎	jcss 依頼試験	
253	28-硬さ	ビッカース硬さ(試験機、標準片)	200 ~ 900 Hv	◎	jcss 依頼試験	
254	28-硬さ	ブリネル硬さ(試験片)	200HBW-500HBW(ノミナル)50HBW間隔	◎	依頼試験	
255	28-硬さ	シヨア硬さ		●		No.253に統合して整理
256	28-硬さ	微小硬さ/極微小硬さ	溶融石英ガラスもしくはBK7 ガラス 試験力 100mN, 押し込み深さ 1000 nm	◎	依頼試験	
258	29-衝撃値	衝撃値	10 J ~ 100 J	◎	依頼試験	
259	29-衝撃値	衝撃値	100 J ~ 170 J	◎	依頼試験	
260	30-粒子・粉体	粒径/粒子質量	100 nm ~ 1 μm	◎	依頼試験	
261-0	30-粒子・粉体	粒径	30 nm ~ 100 nm	◎	依頼試験	
261-1	30-粒子・粉体	液中粒子数濃度	$5 \times 10^2$ 個/g ~ $2 \times 10^6$ 個/g 10 μm ~ 20 μm	◎	依頼試験	
261-2	30-粒子・粉体	気中粒径分布測定器		2014まで		第3期中期計画に移行
261-3	30-粒子・粉体	粒径		2014まで		第3期中期計画に移行
261-4	30-粒子・粉体	気中粒子数濃度測定器	10 nm ~ 200 nm, $10^3 \sim 10^4$ 個/cm <sup>3</sup>	◎	依頼試験	
			供給総数	303		